Se	arch	ı No	tes
		21 21112	



Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/765,954	HWANG ET AL.
Examiner	Art Unit
TAN Y DINIH	2627

	SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			•

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
		•	

SEARCH NO (INCLUDING SEARCH)
	DATE	EXMR
EAST (see search history printout)	3/6/2007	T.D
EAST (see search history printout)	3/7/2007	T.D
		·
· ·		
-		